日本天文学会2010年春季年会 W10b

WISH: フィルターセット検討および3.2µm広帯域フィルター試作試験

○ 矢部清人 (京都大学)、岩田 生 (国立天文台)、東谷千比呂、山田 亨 (東北大学)、 他WISH検討グループ、左近樹(東京大学)

A. 概要

WISHは、口径I.5mの主鏡と視野直径約30分角の近赤外 線カメラを搭載した宇宙望遠鏡衛星を2010年代中盤以降 に打ち上げ、地上からは達成不可能な深さで非常に広域 のサーベイを行なう計画である。

現在、我々はこの科学目標を達成するために最適なフィ ルターセットの検討を行っている。およそI-5µmの波長 域で6枚程度の広帯域フィルターを2種類仮定し、z≈8-15 のdropout銀河の期待される検出数を評価した。また、 現在想定している光学系において、各フィルターセット についての検出限界を推定し、サーベイプランの議論を 行なった。

また、フィルターセットの検討と平行して、宇宙での使 用を目的とした大型近赤外フィルターの制作可能性を検 証するための試作試験を進めている。これまでに、長波 長側の3.2µm広帯域フィルターの試作を行い、WISHで想 定されている80K程度までの冷却サイクル試験や、5年以 上の運用期間中に宇宙線による性能の劣化が生じないか を検証するためのコバルト60によるγ線照射試験などを 行った。その結果、これらの試験に対して概ね耐性を持 つことが確認できた。

B. フィルターシステムの検討

フィルターセットの検討



低赤方偏移の銀河、銀河系内の低温度星の予想 される色を二色図上にプロットする。グレーの 領域の銀河を選択すると、dropout銀河(左の例) では**z>8)**を選ぶことができる。

検出限界とサーベイプラン

現在WISHで想定されている光学系に基づき、理想的な温 度設計が達成出来た場合の検出限界を各フィルターセッ トについて推定した。

コンポーネント名	温度(K)	emissivity(%)	立体角 (str)
主鏡	100	5	0.036
副鏡	100	5	0.036
平面鏡(表面)	100	5	0.023
平面鏡(裏面)	100	5	0.16
第三鏡	100	5	0.057
フィルター	80	10	2.8
クライオスタット	80	10	2.8
スパイダー	100	90	4.5×10 ⁻³

各コンポーネントからの熱放 射はgray bodyを仮定し、各積 分時間で3σ限界等級(0.6"Φ)を 求めた。検出器の効率は60%程 度を仮定。また、フィルター にIxIO-5リークがあると仮定し ている。また、黄道光は極方 向の値の3倍を仮定している。

	Set3			Set4		
nitude (AB) 24 23 22 21 20	.0等に必要な時間 F0 : 32.8 hrs F1 : 26.5 hrs F2 : 21.3 hrs F3 : 15.6 hrs	 Filter 0 (1.0μm) Filter 1 (1.4μm) Filter 2 (1.8μm) Filter 3 (2.3μm) Filter 4 (3.0μm) Filter 5 (4.0μm) 	nitude (AB) 24 23 22 21 20	28.0等に必要な時間 F0:47.5 hrs F1:39.8 hrs F2:33.6 hrs F3:29.0 hrs	Filter 0 (1.0μm) Filter 1 (1.4μm) Filter 2 (1.8μm) Filter 3 (2.3μm) Filter 4 (3.0μm) Filter 5 (4.0μm)	
лд Мад: 25 2	F4 : 12.3 hrs F5 : 32.8 hrs		ng Mag 25 2	F4 : 10.3 hrs F5 : 13.0 hrs		

本ポスター講演では、これまでに行ってきたフィルター セットの検討および3.2µmフィルター試作試験の結果を 報告する。以下、等級はすべてAB等級である。





C.3.2µm広帯域フィルター試作試験

試作試験の概要

宇宙で使用可能な大型近赤外フィルターの制作を検討す るにあたり、まず長波長側での試作試験を行った。今回 中心波長3.2µm幅0.6µmの広帯域フィルターを試作した。 このフィルターはSi基盤に膜を蒸着させた干渉フィル ターでバンドパスフィルター(BPF)とカットフィルター (CUT)の2枚でIセットになっている。サイズは2枚で80 mm x 80 mm x t10 mmで、これに加え25 mmФ x t2 mmの テストピースも試作した。



透過率測定

また、フーリエ分光光度計(FTIR)を用いて、透過率 の測定を行なった。図C4にBPFとCUTの常温での透 過率曲線の様子を示す。BPF+CUTの透過率は、図 **C2**の通り。



60K程度まで冷却して透過率を測 定した際に、3.1µm付近に吸収が 見られた。これは水分子による ものと思われるが、フィルター の製造過程で入ったものか、測 定手順に起因するのかを現在調 査している。







透過率の絶対値には数%の不定性があることに 注意 (以下同様)。

図CI.80mm角の製品フィルター (上)と25 mmΦのテストピース (下)

納品検査/表面精度測定

試作フィルターの納品時にキズや膜の剥 がれなどがないかどうかの検査を行なっ た。表面のキズの有無は目視確認で行な い、膜の剥がれの有無はテープテストで 検査した。テープテストはフィルターの角 部分に絶縁テープを貼り、それを剥がし た時に膜の状態に変化がないかをみるこ とで行なった。



図C7. ZYGOのセッティングおよび測定の様子



図C6. テープテストの様子



図C8.ZYGOによる表面精度測定の結果

国立天文台先端技術センターのZYGO社GPIを用いBPFとCUTの両面に対し表面精度の測定 を行なった。測定波長**λ=500 nm**に対し、RMSで0.2-0.6λという結果になり、『光学研磨程』

冷却サイクル試験

宇宙環境下での運用や打ち上げ時に起こりうる急激な温 度変化に耐性を持つかを調べるため、冷却サイクル実験 を行なった。

常温から80Kまで冷やし、その後常温に戻す温度変化をI サイクルとし、Iサイクル当たり4時間かけるものと2時間 かけるものの2種類の実験を行なった。

実験の方法は、真空を引いたデュワー内にフィルターを 設置し、液体窒素に接触させながらヒーターで温度変化 をコントロールすることで行なった。各サイクルについ て、温度および真空度の変化は図CI0の通り。

各サイクルの後に、目視およびテープテストを行なった が、フィルター表面および膜に異常は見られなかった。





図C9. (左上) 冷却サイクル実 験の様子。(左下)冷却サイク ル実験に使用したデュワー。 (右下) フィルターホルダー に収まったフィルター





図CI0.冷却サイクルにおける温度変化および真空度変化。図 中のSlowは4時間のサイクル、Rapidは2時間のサイクル。

度』という試作の条件を満たしていることを確認した。

納品検査の結果、重大なキズや膜の剥がれなどは見られなかった。透過率測定の結果、ほ ぼ仕様通りの透過率のフィルターが出来たことが分かった。また、表面精度も仕様通りに 出来ている事が分かった。

更に急激な温度サイクルとして、テストピースを液体窒 素の中に直接入れる実験を行なった。

約15分間液体窒素に浸した後、フィルター表面の状態 を目視確認したが、異常は見られなかった。また、 テープテストの結果、膜に異常は見られなかった。

放射線照射試験

都立産業技術センター協力の元、コバルト60によるγ線照射試験を行った。 照射量はフィルターの放射線源からの距離で決まり、5時間で計7 kradと14 kradの2種類を設定した。この照射量はL2点上での典型的な宇宙線量とエネ ルギーをそれぞれ10 prticles/cm²/sと300MeVと仮定した時の5年間(WISHが予 定するミッション期間)の放射線量に対応する。



図CI3 放射線源が露出している様子。 中央やや下にフィルターと同じ高さに ある棒状の放射線源が見える。

目標の放射線量を照射した後に、フィルター表面 を目視検査した結果、目立った変化はなかった。 また、テープテストを実施した結果、表面の膜が 剥がれるなどの現象は起こらなかった。

また、常温での透過率を測定した所、透過率曲線 の形や波長範囲の変化などは見られなかった。



図CI2. 放射線試験の様子。(左上)上から見たフィルターの配置。右側の球体が放射線源の 位置に対応。(右上) 正面から見たフィルターの配置。(左下) 7 kradに対応する位置のフィル タースタンド。(右下) 14 kradに対応する位置のフィルタースタンド。

D. まとめと今後の課題

WISHの科学目標を達成するために最適なフィルターセットの検 討を行った。およそI-5µmの波長域で6枚程度の広帯域フィルター を2種類仮定し、z≃8-I5のdropout銀河の期待される検出数を評価 した。また、現在想定している光学系において、各フィルター セットについての検出限界を見積り、サーベイプランの議論を行 なった。

また、長波長側の3.2µm広帯域フィルターの試作を行い、WISH で想定されている80K程度までの冷却サイクル試験や、5年分に相 当する量のγ線照射試験などを行った。その結果、これらの試験 に対して概ね耐性を持つことが確認できた。今後、短波長側の フィルターの試作も含め、振動や曲げ応力試験など更なる耐久試 験を行う予定である。